



# کاربردهای مقطع نگاری الکتریکی و نوری در

## صنعت نفت و گاز

محمد رضا یوسفی نجف آبادی<sup>۱</sup>، مائده هادی نیا<sup>۱</sup>، رضا جعفری<sup>۱</sup>

حمید ابریشمی مقدم<sup>۱</sup>، حمید رضا تقی راد<sup>۲</sup>

<sup>۱</sup> گروه مهندسی پزشکی، دانشکده برق، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران

<sup>۲</sup> گروه کنترل، دانشکده برق، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران

yousefi@eetd.kntu.ac.ir, m\_hadinia@ee.kntu.ac.ir, jafari@eetd.kntu.ac.ir,  
moghadam@eetd.kntu.ac.ir, taghirad@kntu.ac.ir

### چکیده:

یکی از نیازهای متخصصین در صنعت کسب اطلاع از وضعیت داخلی لوله‌ها، مخزن‌ها و حفره‌های حاوی نفت، گاز و مشتق‌ات آن‌ها است که به طور معمول دسترسی به داخل آن‌ها بدون قطع فرآیند تولید ممکن نیست. نیاز به کسب این اطلاعات موجب شده تا تحقیقات زیادی در زمینه روش‌های مختلف اندازه گیری‌ها و آزمون‌های غیر مخرب صورت گیرد. استفاده از مقطع نگاری به عنوان یک روش تصویربرداری غیر مخرب از داخل خطوط لوله‌های انتقال نفت و گاز برای پایش مواد تشکیل دهنده سیال‌ها و اندازه گیری جریان و دبی سیال‌های چند فازه در طی سال‌های اخیر از اهمیت خاصی برخوردار شده و در حال گسترش است. یکی از مهم‌ترین ضروریات این تحقیق همگام شدن با توسعه این تکنولوژی و رقابت با فناوری‌های وارداتی می‌باشد. یکی از گروه‌های تحقیقاتی فعال که از سال ۱۳۸۵ فعالیت تحقیقاتی و صنعتی خود را در زمینه سیستم‌های مقطع نگاری الکتریکی و نوری آغاز کرده است، گروه مقطع نگاری الکتریکی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی است که تا کنون اقدام به ساخت سیستم‌های مختلف مقطع نگاری، از جمله مقطع نگاری مقاومتی، مقطع نگاری امپدانسی، مقطع نگاری خازنی با کاربردهای صنعتی و پزشکی نموده و در حال طراحی و ساخت سیستم‌های دیگری از جمله مقطع نگاری القای مغناطیسی می‌باشد. در این مقاله ضمن معرفی مختصر روش‌های فوق الذکر و بررسی کاربرد این روش‌ها در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی به ذکر فعالیت‌های انجام شده در این گروه در زمینه مقطع نگاری الکتریکی خواهیم پرداخت و در نهایت به مقایسه این روش‌ها برای کاربردهای فوق الذکر خواهیم پرداخت.

**واژه‌های کلیدی:** مقطع نگاری لوله‌های نفت و گاز، تصویر برداری غیر مخرب لوله‌های نفت و گاز و پتروشیمی، مقطع نگاری مقاومتی، مقطع نگاری امپدانسی، مقطع نگاری خازنی، مقطع نگاری الکترو مغناطیسی، مقطع نگاری نوری.

## ۱- مقدمه

مقطع نگاری از واژه "توموز"<sup>۱</sup> که واژه ای یونانی به معنی "یک مقطع" یا "یک برش" است، گرفته شده است. بدست آوردن یک تصویر از یک سطح مقطع را مقطع نگاری گویند. این عمل با استفاده از انرژی دار کردن ناحیه مورد نظر، انجام اندازه گیری های از روی سطح ناحیه و بدست آوردن تصویر از این اندازه گیری ها صورت می پذیرد. مقطع نگاری الکتریکی علاوه بر کاربردهای پزشکی کاربردهای مهمی در صنعت نفت نیز دارد. حدود ۱۵ سال پیش استفاده از خواص الکترومغناطیسی استاتیکی اجسام جهت مقطع نگاری غیر تهاجمی در فرکانس های پایین زیر ۲ مگا هرتز مورد توجه پژوهشگران قرار گرفت. در زمینه مقطع نگاری پزشکی غیر تهاجمی، "هولدر" در سال ۱۹۹۲ و "بران" در سال ۱۹۹۶ و در زمینه مقطع نگاری صنعتی، "ویلیام" و "بک" در سال ۱۹۹۵ آغاز گر راه بوده اند [۱].

تصویربرداری از داخل خطوط لوله های نفت، پایش مواد تشکیل دهنده سیال و اندازه گیری دبی سیال (نفت و گاز) در خطوط لوله های انتقال از کاربردهای مهم مقطع نگاری الکتریکی است. علاوه بر این سه کاربرد اصلی، امروزه مقطع نگاری الکتریکی کاربردهای متعدد دیگری نیز در صنعت پیدا کرده است. بعضی از این کاربردها تا به حال جنبه صنعتی پیدا کرده و به صورت تجاری وارد بازار شده اند و تعدادی دیگر در حال گذراندن تست های عملیاتی جهت تکمیل بوده و تعدادی دیگر تا مرحله آزمایشگاهی پیشرفت و هنوز وارد عرصه عملیاتی در صنعت نشده اند. تعدادی از این کاربردها در صنعت نفت عبارت از مانیتورینگ جریانات چند فازه<sup>۲</sup>، تشخیص نشتی در لوله های و مخازن دفن شده، عملیات اکتشافی زمین شناسی برای شناسایی بستر های مایعات زیر زمینی، مانیتورینگ مراحل پلیمریزاسیون نایلون، مانیتورینگ فیلتراسیون تحت فشار و مانیتورینگ احتراق و انفجار می باشند. پایین بودن هزینه ساخت، سرعت بالا، امنیت و مناسب بودن برای لوله ها و مجاری با ابعاد مختلف دلایلی هستند که سبب شده علاقه بیشتری برای استفاده از سیستم های مقطع نگاری الکتریکی در صنعت به وجود آید [۲].

مقطع نگاری الکتریکی یک روش تصویر برداری از توزیع امپدانسی درون شی، با استفاده از اندازه گیری هایی از سطح آن می باشد. کمیت های فیزیکی مختلف مواد در ناحیه مقطع نگاری، امکان اندازه گیری های متفاوتی را ایجاد می کند که منجر به پیدایش سیستم های مقطع نگاری متفاوتی می شود به طوری که پیاده سازی مقطع نگاری برای فرایندها توسط روش های گوناگونی صورت می پذیرد. روش های مقطع نگاری الکتریکی بر اساس اندازه گیری سه ویژگی الکتریکی موجود در اجسام شامل ضریب هدایت الکتریکی( $\sigma$ )، نفوذ پذیری الکتریکی( $\epsilon$ ) و نفوذ پذیری مغناطیسی( $\mu$ ) کار می کنند و بر این اساس این روش ها به سه زیر شاخه مقطع نگاری امپدانس الکتریکی<sup>۳</sup> (EIT)، مقطع نگاری ظرفیت خازنی الکتریکی<sup>۴</sup> (ECT) و مقطع نگاری القای مغناطیسی<sup>۵</sup> (MIT) تقسیم می شوند.

مقطع نگاری نوری نیز از جمله روش های مانیتورینگ فرآیندهای صنعتی درون لوله ای و درون حفره ای می باشد که در دسته بندي مجزا قرار می گيرد و بر اساس اعمال یک نور ورودی و شناسایی خواص شکست، جذب و تفرق نور در داخل سیال عمل می کند [۳].

<sup>1</sup> Tomos

<sup>2</sup> Multi-phase Flow

<sup>3</sup> Electrical impedance tomography

<sup>4</sup> Electrical capacitance tomography

<sup>5</sup> Magnetic induction tomography

در مسئله مقطع نگاری با یک مسئله معکوس و یک مسئله معکوس شامل تعیین توزیع امپدانسی از روی ولتاژهای اندازه گیری شده می‌باشد. مسئله معکوس بد وضع می‌باشد زیرا به علت تعداد مجھولات زیاد و محدود بودن اندازه گیری‌ها لزوماً جواب یکتا نداشته و همچنین تغییرات بزرگ در توزیع امپدانس تغییرات اندکی در مقادیر خروجی به وجود می‌آورد. معمولاً برای مدل‌سازی مسئله پیشرو از روش‌های اجزاء محدود<sup>۶</sup> (FEM) و اجزای مرزی<sup>۷</sup> (BEM) استفاده می‌شود.

## ۲- سیستم مقطع نگاری امپدانس الکتریکی

قدیمی‌ترین روش تصویر برداری الکتریکی، تصویربرداری به روش امپدانس الکتریکی می‌باشد. در این روش از اتصال آرایه‌ای از الکترودهای سطحی به اطراف ناحیه تصویربرداری استفاده می‌شود. جریان به وسیله تعدادی از این الکترودهای سطحی به شیء تزریق شده و پتانسیلهای الکتریکی از طریق الکترودهای دیگر اندازه گیری می‌شود. در روش‌های جدیدتر که حساسیت آن‌ها از روش‌های قبلی بهتر است، تمامی الکترودها در یک لحظه نمونه برداری منبع جریان بوده و در لحظه بعدی اقدام به اندازه گیری ولتاژ از ناحیه هدف می‌نمایند [۴].

با اندازه گیری امپدانس انتقالی<sup>۸</sup> شیء هدف در جهت‌های مختلف، ضرایب هدایت الکتریکی<sup>۹</sup> (S) و نفوذ پذیری الکتریکی (E) قابل محاسبه است. در بعضی از روش‌های دیگر که به مقطع نگاری مقاومتی (ERT) معروف هستند از ضریب نفوذ پذیری الکتریکی صرف نظر می‌شود. به عنوان نمونه شکل (۱) یک نمونه سیستم مقطع نگاری مقاومتی به کار گیری شده برای اندازه گیری روی خط<sup>۱۰</sup> دبی<sup>۱۱</sup> سیال را نشان می‌دهند [۵]. شکل (۲) نیز نمونه‌ای دیگر از سیستم‌های اندازه گیری روی خط دبی با استفاده از مقطع نگار امپدانس الکتریکی ۱۶ الکترودی را نشان می‌دهد [۶].

در سال ۱۳۸۵ پس از تشكیل هسته اولیه گروه مقطع نگاری الکتریکی در دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی، اولین سیستم مقطع نگاری مقاومتی در این گروه در سال ۱۳۸۷ ساخته شد. در این سیستم جریان‌ها به دو الکترود اعمال گردیده و ولتاژها از دیگر الکترودها اندازه گیری شدند.

در آزمایش این سیستم برای دریافت داده‌های واقعی از یک فانتوم استوانه‌ای شکل و با شعاع ۰/۳۵ متر، ارتفاع ۰/۰ متر و از جنس P.V.C ساخته شده بود. محفظه داخلی این فانتوم از محلول آب نمک استاندارد ۳٪ پر شده بود. برای دریافت داده از فانتوم، از چهار الکترود استفاده شده است که دو الکترود برای اعمال جریان و دو الکترود دیگر نیز برای اندازه گیری ولتاژ حاصل از آن بکار می‌رود. الکترودهای استفاده شده نیز از جنس Ag/AgCl می‌باشند [۷-۸]. در تحقیقات بعدی در سال ۱۳۸۸ با به کار گیری مدولاتورهای حساس به فاز در این سیستم تغییراتی ایجاد شد و سیستم مقطع نگاری مقاومتی به سیستم مقطع نگاری امپدانسی تبدیل گردید که در سیستم جدید، مؤلفه‌های حقیقی و موهومی توأمًا اندازه گیری شدند [۹].

در سال ۱۳۸۹ با ساخت یک سیستم دیگر و با بهره گیری از بهبود نرم افزاری روش پیشرو و افزایش تعداد الکترودها و ترکیب المان‌های سه ضلعی و چهارضلعی، دقت تفکیک پذیری سیستم بهبود یافت. بهبود سخت افزاری در ساخت منبع جریان

<sup>6</sup> Finite element method

<sup>7</sup> Boundary element method

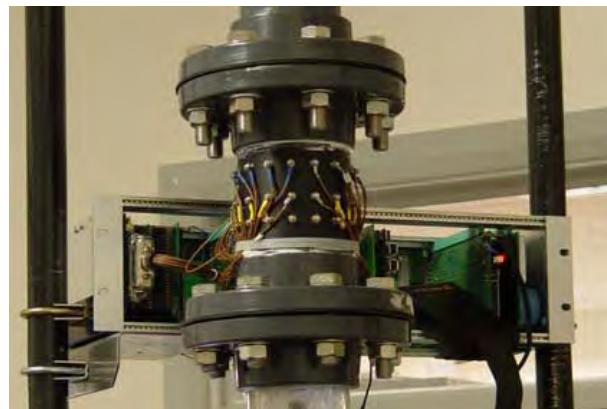
<sup>8</sup> Transimpedance

<sup>9</sup> Resistance tomography

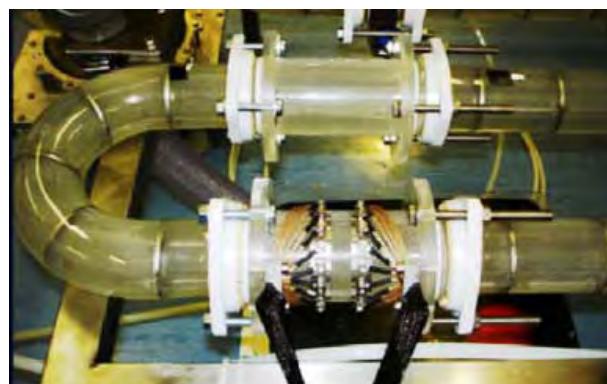
<sup>10</sup> On line

<sup>11</sup> Flow

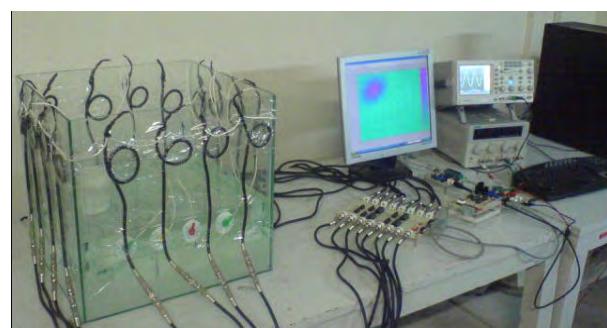
جدید، مالتی پلکسرهای، فانتوم و طراحی کارت واسط از دیگر تغییرات سیستم جدید مقطع‌نگاری امپدانسی بود. شکل (۳) این سیستم را به همراه فانتوم ۱۶ الکتروودی ساخته شده نشان می‌دهد. در این سیستم در هر لحظه یک جفت الکتروود، جریان را تزریق کرده و سایر الکتروودها وظیفه اندازه‌گیری ولتاژ را بر عهده دارند [۱۰].



شکل(۱): استفاده از سیستم مقطع‌نگاری مقاومتی جهت اندازه‌گیری روی خط دبی [۵].



شکل(۲): استفاده از یک سیستم مقطع‌نگاری امپدانسی ۱۶ الکتروودی جهت اندازه‌گیری روی خط دبی [۶].

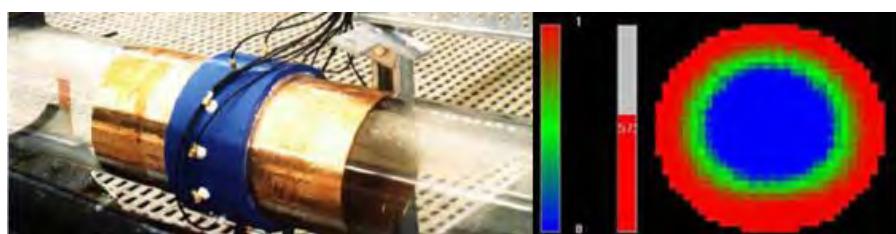


شکل(۳): فانتوم ۱۶ الکتروودی استفاده شده در سیستم مقطع‌نگاری امپدانسی [۱۰].

### ۳- سیستم مقطع‌نگاری ظرفیت خازنی الکتریکی

روش دیگر تصویر برداری الکتریکی، تصویر برداری به روش ظرفیت خازنی الکتریکی می‌باشد. در این روش نیز از یک آرایش الکتروودهای سطحی استفاده شده و یک میدان الکتریکی به ماده اعمال می‌شود و پس از آن توسط داده‌های الکتروودهای سطحی، توزیع ضرایب نفوذ پذیری الکتریکی (E) بدست می‌آید. تفاوت بین این روش و مقطع‌نگاری امپدانسی در این است که

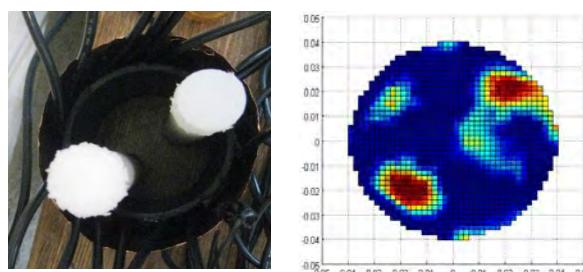
در مقطع‌نگاری ظرفیت خازنی الکتریکی بجای اندازه گیری امپدانس، ظرفیت خازنی بین جفت الکترودهای متفاوت اندازه گیری می‌شود. این روش برای اشیاء با ضریب نفوذ پذیری کم و ضریب هدایت ناچیز با مرزهای عایق مفید می‌باشد. تکنیک‌های مقطع‌نگاری الکتریکی به واسطه ارزان بودن، امنیت بالا، سرعت بالای جمع‌آوری اطلاعات و مناسب بودن برای مجاری و لوله‌ها با ابعاد مختلف نقش بسیار مهمی در کاربردهای صنعتی جهت به تصویر درآوردن فرایندها دارند. از میان تکنیک‌های مقطع‌نگاری الکتریکی، تکنیک مقطع‌نگاری الکتریکی خازنی به دلیل توانایی تشخیص بین فازهای متفاوت مبنی بر توزیع ضرایب نفوذ پذیری الکتریکی در سطح مقطع مورد نظر، به شکل گسترده‌ای موضوع بسیاری از تحقیق‌های روز دنیا شده است [۱۱]. تحقیق در زمینه مقطع‌نگاری الکتریکی خازنی با رشته‌های مختلف علمی مرتبط است و زمینه‌های تحقیق آن را می‌توان به سه دسته طراحی حسگر، الکترونیک سخت افزار و بازسازی تصویر تقسیم بندی کرد. نمونه‌ای از یک سیستم مقطع‌نگار در شکل (۴) نشان داده شده است. در این شکل حباب‌های جریان نفت در لوله به تصویر کشیده شده است [۱۲].



شکل (۴): تصویر بازسازی شده در سیستم مقطع‌نگاری الکتریکی خازنی نشان دهنده حباب‌های جریان نفت [۱۲].

در سال ۱۳۸۸ گروه مقطع‌نگاری الکتریکی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی اقدام به طراحی و ساخت یک سیستم مقطع‌نگاری خازنی الکتریکی کرد [۱۱]. این سیستم با تخمین ضرایب نفوذ پذیری الکتریکی مواد درون سطح مقطع لوله‌ها و یا مجاری اقدام به بازسازی تصاویر سطح مقطعی از مجاری و لوله‌ها می‌کند. تخمین ضرایب نفوذ پذیری الکتریکی توسط اندازه گیری خازن‌های روی سطح شی و حل یک مسئله معکوس صورت می‌پذیرد.

در این سیستم، حل مسئله پیشرو با روش اجزای محدود انجام شده و دو روش "انتگرال گاوی" و روش "بار" جهت محاسبه خازن‌ها در مسئله معکوس استفاده شده است. سیستم مقطع‌نگار ارائه شده با استفاده از مدار شارژ و دشارژ ساخته شده است. تصاویر بازسازی شده با استفاده از داده‌های سیستم عملی در اولین نمونه ساخته شده نتایج رضایت‌بخشی را ایجاد کرد. نتایج تصاویر بازسازی شده سیستم مقطع‌نگاری خازنی ساخته شده به همراه فانتوم در حضور اشیاء مختلف در شکل (۵) نشان داده شده است.



استفاده شده در مقطع‌نگاری

شکل (۵): سمت چپ: فانتوم

خازنی، سمت راست تصویر بازسازی شده [۱۱].

#### ۴- سیستم مقطع نگاری القای مغناطیسی

یکی دیگر از روش‌های مقطع‌نگاری، تصویربرداری به روش القای مغناطیسی می‌باشد. این روش در سال ۱۹۹۳ پایه گذاری شده است. در این روش یک میدان مغناطیسی قوی توسط چند سیم پیچ تحریک به شیء هدف اعمال شده و باعث ایجاد جریان‌های گردابی در درون شیء می‌شوند. داده‌های خروجی از سیم‌پیچ‌های اندازه‌گیری ولتاژ برای بازسازی تصویر مورد استفاده قرار می‌گیرد. مقطع‌نگاری القای مغناطیسی به هر دو ضریب هدایت الکتریکی<sup>(۵)</sup> و نفوذ پذیری مغناطیسی<sup>(۶)</sup> حساس بوده و به وسیله ولتاژ‌های اندازه‌گیری شده به وسیله سیم پیچ‌های حسگر (سنسورهای القایی بسیار حساس)، این ضرایب در شیء هدف قابل محاسبه می‌باشند [۱۳]. این روش تصویر برداری با نام‌های دیگری همچون مقطع‌نگاری اندوکتانسی<sup>(۷)</sup> و مقطع‌نگاری الکترومغناطیسی<sup>(۸)</sup> نیز شناخته می‌شود.

البته اخیراً روش‌های ترکیبی دیگری نیز ابداع شده‌اند که از جمله آن‌ها می‌توان به اعمال میدان مغناطیسی توسط سیم‌پیچ‌های تحریک و ثبت پتانسیل‌های القایی در شیء هدف توسط الکترودهای سطحی<sup>(۹)</sup> یا اعمال جریان خارجی به شیء هدف توسط الکترودهای سطحی و حس میدان مغناطیسی خارج شده از شیء هدف به وسیله سنسورهای القایی اشاره کرد [۱۴-۱۵]. این روش‌ها به نام مقطع‌نگاری الکتریکی مغناطیسی امپدانسی<sup>(۱۰)</sup> شناخته می‌شوند.

از مقطع‌نگاری القای مغناطیسی در کاربردهای صنعتی در جاهایی که خواص هدایت الکتریکی و نفوذ پذیری مغناطیسی اجسام اهمیت دارد، به ویژه مانیتورینگ فرایندهای صنعتی، آزمون غیر مخرب و ژئوفیزیک استفاده می‌شود. به عنوان مثال‌هایی از کاربرد این روش صنعتی، می‌توان به تشخیص اجسام خارجی در دستگاه‌های خطرناک، تشخیص اجسام خارجی در صنایع غذایی، تشخیص اجسام خارجی در لوله‌های نفت و گاز، تشخیص ترک‌ها در بازرگانی خطوط لوله‌های نفت و گاز، دسته بندی فلزات، تشخیص ضخامت جوش یا هدایت الکتریکی و مشاهده روی خط در صنایع تولید فلز اشاره کرد. بازسازی تصویر در این روش نیز، یک مسئله معکوس بد وضع شده غیر خطی<sup>(۱۱)</sup> می‌باشد که تا کنون از روش‌های زیادی برای بازسازی این تصویر استفاده شده است [۱۷].

شمای کلی از یک سیستم مقطع‌نگاری القای مغناطیسی نمونه در شکل<sup>(۱۲)</sup> نشان داده شده است، که از سه بخش کلی آرایه سنسورها، مدارهای الکترونیکی واسطه و کامپیوتر تشکیل شده است. در این سیستم انرژی به شیء هدف به وسیله اعمال یک جریان سینوسی به یک یا چند سیم پیچ تحریک اعمال می‌شود و ولتاژ‌های اندازه‌گیری شده توسط سیم پیچ‌های گیرنده حاصل جمع آثار<sup>(۱۳)</sup> میدان‌های اعمال شده توسط سیم پیچ‌های تحریک می‌باشد [۱۸]. هر چقدر تعداد دفعات اعمال میدان و به طبع آن تعداد اندازه‌گیری‌ها بیشتر باشد، کیفیت تصویر بازسازی شده بهتر خواهد بود. پس از این مرحله سیگنال‌های خروجی از سیم پیچ‌های گیرنده، گسسته سازی شده و وارد کامپیوتر می‌شوند. سپس به وسیله یک الگوریتم بازسازی، یک تصویر از شیء هدف بدست می‌آید. تصویر بدست آمده در لبه‌های خارجی شیء هدف شامل جزئیات بیشتری نسبت به مرکز شیء می‌باشد. تفاوت سیستم‌های مختلف مقطع‌نگاری القای مغناطیسی در آرایه سنسورها (نحوه چیدمان سیم پیچ‌های گیرنده)، فرکانس کاری (سیم پیچ تحریک) و نحوه حس میدان‌های تشخیصی توسط سنسورهای القایی (سیم‌پیچ‌های گیرنده) می‌باشد [۱۹-۲۱]. میدان حس شده توسط سنسورهای اندازه‌گیری ولتاژ، شامل میدان اولیه ناشی از میدان تحریک اصلی و

<sup>۱۲</sup> Mutual inductance tomography(also MIT)

<sup>۱۳</sup> Electromagnetic tomography (EMT)

<sup>۱۴</sup> Magnetic electrical impedance tomography

<sup>۱۵</sup> Ill-posed problem non linear

<sup>۱۶</sup> Projection

میدان ثانویه ناشی از جریان‌های گرد آبی درون شی می‌باشد. برای تشخیص میدان ثانویه به یک آشکار ساز حساس به فاز برای تمیز دادن این دو نوع میدان نیاز داریم [۲۱].

از جمله خصوصیات سیستم‌های مقطع نگاری القای مغناطیسی صنعتی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

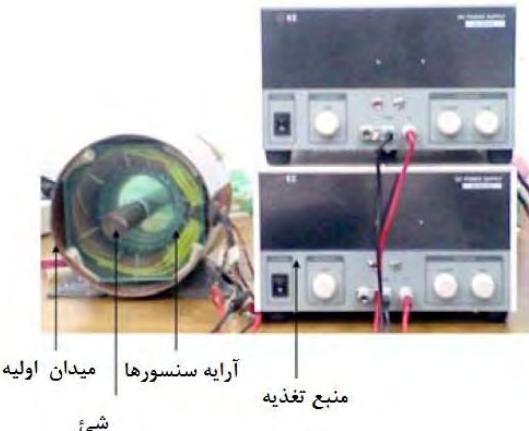
- هدایت الکتریکی در شیء هدف زیاد است.

- فرکانس کاری پایین برای تحریک استفاده می‌گردد (تا ۵۰۰ KHZ).

- در اشیاء فرو مغناطیس، سیگنال اولیه هم فاز با سیگنال اولیه می‌باشد ( $\Delta B$  حقیقی و مثبت).

- در اشیاء با هدایت الکتریکی بالا (فلزات)، سیگنال ثانویه دارای قسمت حقیقی منفی و یک قسمت موهومی است.

- اندازه میدان ثانویه ( $\Delta B$ )، حدود ۲۵٪ اندازه میدان اصلی (B) است.



شکل (۶): شماتیکی از یک سیستم مقطع نگاری القای مغناطیسی [۱۸].

سیستم‌های مقطع نگاری القای مغناطیسی چند فرکانسی نیز مورد استفاده قرار گرفته‌اند [۲۳-۲۴]. مقایسه‌ای از سه روش مقطع نگاری الکتریکی در جدول (۱) آورده شده است [۲۵].

جدول (۱): مقایسه روش‌های مقطع نگاری الکتریکی [۲۳].

نوع حسگر	کمیت اندازه گیری	خواص مواد	مواد نمونه
ECT	خازن	$10^2 < \epsilon_r < 10^5$ $\sigma < 10^{-2} S/m$	نفت، آب یونیزه <sup>۱۷</sup> ، پودرهای غیر فلزی، پلیمرها، گازهای مشتعل
EIT	مقاومت (امپدانس)	$10^{-2} < \sigma < 10^5 S/m$ $10^2 < \epsilon_r < 10^5$	آب، آب نمک، بافت‌های زیستی <sup>۱۸</sup> ، مواد زمین شناسی <sup>۱۹</sup> ، نیمه هادی‌ها
MIT	سلف/اندوکتانس متقابل	$10^2 < \mu_r < 10^4$ $10^2 < \sigma < 10^5 S/m$	فلزات، برخی کانی‌ها، مواد مغناطیسی، آب یونیزه شده

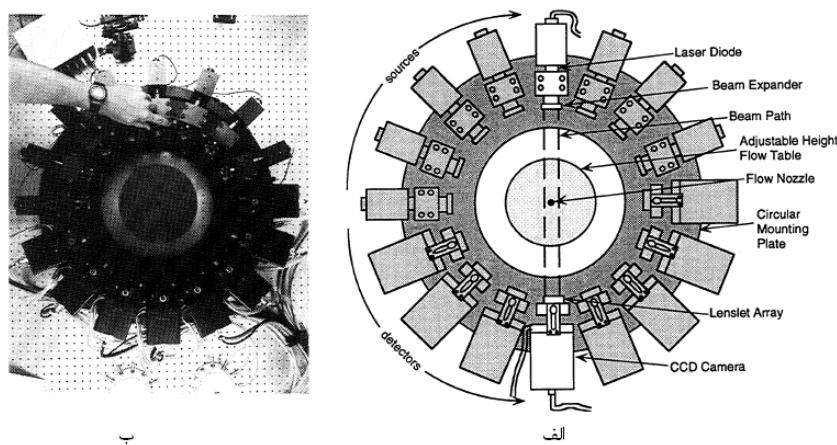
<sup>۱۷</sup> De-ionized water

<sup>۱۸</sup> Biological tissue

<sup>۱۹</sup> Geological materials

## ۵- سیستم مقطع نگاری نوری

روش‌های نوری برای تصویربرداری سه بعدی از فلوي سیال و فلوي هواي گرم شده مورد استفاده قرار می‌گيرند [۳] و [۲۶]. توجه قابل توجهی در تشخیص ساختار سازمان یافته انتقال جريان سیال با دقت تفکیک‌پذیری مكانی و زمانی بالا با یک اندازه‌گیری غیرتھاجمی وجود دارد. شماتیک یک سیستم مقطع‌نگاری نوری در شکل (۷-الف) نمایش داده شده است. نمونه آزمایشگاهی این سیستم نیز در شکل (۷-ب) نمایش داد شده است. این سیستم شامل ۸ منبع دیود لیزری و ۸ آشکارساز دوربین CCD است. این آشکارسازها به طور همزمان تابش لیزر خارج شده از محیط پس از عبور از گاز یا سیال را اندازه می‌گيرند. این اندازه‌گیری‌ها به عنوان ورودی به یک الگوریتم بازسازی مقطع‌نگاری استاندارد وارد می‌شوند تا یک تصویر دو یا سه بعدی از جريان سیال یا گاز ایجاد شود. بازسازی تصویر در مقطع نگاری پخشی نوری به روش معکوس انجام می‌شود. در روش معکوس معمولاً از یک فرآيند تكراري که در آن یک مدل پيشرو به يكسری فرضيات اوليه برای پارامترهای محیط اعمال می‌شود استفاده می‌شود. مقایسه مجموعه کمیت‌های اندازه‌گیری واقعی و مدل شده به اصلاح توزيع پارامترها منجر می‌شود که می‌تواند به طور تکراری به مدل پيشرو وارد شود تا جايی که اختلاف اين دو مجموعه داده به نحو بهينه‌ای کوچک شود.



شکل(۷)-الف: شماتیک یک سیستم مقطع‌نگاری نوری، ب: نمونه‌ای آزمایشگاهی یک سیستم مقطع‌نگاری نوری [۲۶].

## ۶- نتیجه‌گیری

نياز به بررسی داخل اشیاء و فضاهایی که در عمل دسترسی به داخل آن‌ها بدون قطع فرآيند تولید امکان پذیر نمی‌باشد یکی از اساسی‌ترین نیازهای تمامی فرآيندهای تولیدی پیوسته است که صنعت نفت و گاز نیز یکی از عمده‌ترین آن‌ها به شمار می‌رود. بنابراین می‌توان در کاربردهای مانیتورینگ پیوسته در دبی‌های بالا از این روش‌ها بهره زیادی برد. می‌توان تصاویر بدست آمده از این روش‌ها را مورد تحلیل قرار داد تا پارامترهایی، نظیر ابعاد فضای حباب هوا، سرعت رژیم سیال، شروع کریستال سازی و غیره بدست آید. مهم‌ترین مزایای روش‌های مقطع‌نگاری شامل غیر تھاجمی بودن، غیر تداخلی بودن، کم بودن هزینه ساخت، سرعت نمونه برداری بالا و قابلیت تصویر برداری روی خط لحظه به لحظه می‌باشد. تجهیزات سیستم نیز نسبتاً سبک و ساده بوده و به راحتی قابل نصب و استفاده می‌باشند. با این وجود تفکیک پذیری فضایی نسبتاً کم در تصاویر بازسازی شده، غیر خطی بودن و بد وضعی معادلات حاكم بر سیستم، چالش‌های بزرگ مطرح شده در مواجه با سیستم‌های مقطع‌نگاری الکترونیکی می‌باشند [۲۴].

## مراجع

- [1] B. Brown, "Medical impedance tomography and process impedance tomography: a brief review," *Meas. Sci. Technol.*, vol. 12, pp. 991-996, 2001.
- [2] I. Evans and T. York, "Microelectronic capacitance transducer for particle detection," *IEEE Sensors Journal*, vol. 4, pp. 364-372, 2004.
- [3] L. McMackin, R. J. Hugo, R. E. Pierson, and C. R. Truman, "High speed optical tomography system for imaging dynamic transparent media," *Optics Express*, Vol. 1, pp. 301-311 ,1997.
- [4] R. Williams and M. Beck, *Process tomography: principles, techniques, and applications*, Butterworth-Heinemann, 1995.
- [5] H. Li, M. Wang, Y. Wu, Y. Ma, R. Williams, "Measurement of oil volume fraction and velocity distributions in vertical oil-in-water flows using ERT and a local probe," *Journal of Zhejiang University Science*, Vol. 6A, pp. 1412-1415, 2005.
- [6] G. Vilar, R. A. Williams, M. Wang, R. J. Tweedie, "On line analysis of structure of dispersions in an oscillatory baffled reactor using electrical impedance tomography,", *Chemical Engineering Journal*, vol.141, pp. 58–66, 2008.
- [۷] نصیره دیاریان و رضا جعفری, "کاربرد مقطع نگاری امپدانس الکتریکی در تست‌های غیر مخرب و مهندسی پزشکی و پیشرفت‌های اخیر آن " دومین کنفرانس بین المللی بازرسی فنی و آزمون غیر مخرب، تهران، ۱۳۸۷.
- [۸] نصیره دیاریان, "مدل‌سازی اجزاء محدود و ساخت یک سیستم مقطع نگاری امپدانس الکتریکی", پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، ۱۳۸۷.
- [۹] سید احمد حمیدی, "طراحی و پیاده سازی یک دمودلاتور حساس به فاز دیجیتال برای استفاده در سیستم‌های مقطع نگاری الکتریکی", پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، ۱۳۸۸.
- [۱۰] عباس نصوري, "بهبود و تعیین دقیقیت تفکیک پذیری یک سیستم مقطع نگاری امپدانس الکتریکی", پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، ۱۳۸۹.
- [۱۱] کیان در, "طراحی و پیاده سازی دستگاه مقطع نگار الکتریکی خازنی", پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، ۱۳۸۸.
- [12] Q. Marashdeh, "Advances in electrical capacitance tomography," Ph.D. hesis, The Ohio State University, 2006.
- [13] M. Soleimani and A. Tamburrino, "Shape reconstruction in magnetic induction tomography using multi frequency data," *International Journal of Information and Systems Sciences*, Vol. 2, pp. 343-353, 2006.
- [14] J. M. Scaife, R. C. Tozer and I. L. Freeston, "Conductivity and permittivity images from an induced current electrical impedance tomography system," *IEE Proc.*, Vol. A.141, pp. 356-362, 1994.
- [15] B. Horner and F. Mesch, "An induction flowmeter insensitive to asymmetric flow profiles," *European Concerted Action on Process Tomography Conf.*, pp. 321-330,1995.
- [16] Y. Tomita and S. Honda, "Estimation of velocity profile by magnetic flowmeter with rotating field," *SICE Conf.*, pp. 1301-1304, 1992.
- [17] A. J. Peyton, Z. Z. Yuy, G. Lyony, S. Al-Zeibaky, J. Ferreira, J. Velezz, F. Linharesz, A. R. Borgesz, H. L. Xiongx, N. H. Saundersk and M. S. Becky, "An overview of electromagnetic inductance tomography: description of three different systems," *Meas. Sci. Technol.*, Vol. 7 , pp. 261-271, 1996.
- [18] G. S. Park and S. Kang, "A study on the determination of the object shape in magnetic inductance tomography system," *12th Biennial IEEE Conference on Electromagnetic Field Computation*, pp. 72-77, 2006.
- [19] X. Ma, A. J. Peyton, S. R. Higson, A. Lyons and S. J. Dickinson, "Hardware and software design for an electromagnetic induction tomography (EMT) system for high contrast metal process applications," *Meas. Sci. Technol.*, Vol. 17 , pp. 111–118, 2006.
- [20] M. Soleimani, W. R. B. Lionheart, A. J. Peyton, X. Ma, and S. R. Higson, " A three dimensional inverse finite element method applied to experimental eddy current imaging data," *IEEE Transactions on Magnetics.*, Vol. 42, pp. 1560-1567, 2006.
- [21] H. Griffiths, "Magnetic induction tomography," *Measurements Science Technology*, Vol. 12, pp. 1126-1131 ,2001.
- [22] T. York, "Status of electrical tomography in industrial applications," *Journal of Electronic Imaging*, vol. 10, pp. 608, 2001.
- [23] J. Rosell-Ferrer, R. Merwa, P. Brunner and H. Scharfetter, "A multifrequency magnetic induction tomography system using planar gradiometers: data collection and calibration," *Measurements Science Technology*, Vol. 12, pp. 1126–1131, 2006.



- [24] H. Scharfetter, A. Kostinger and S. Issa, "Hardware for quasi-single-shot multifrequency induction tomography: the Graz Mk2 system," *Physiological Measurements*, Vol. 29, pp. S431-443, 2008.
- [25] N. Reinecke and D. Mewes, "Recent developments and industrial/research applications of capacitance tomography," *Measurements Science Technology*, Vol. 7, pp. 233-246, 1996.
- [26] R. E. Pierson, E. Y. Chen, K. P. Bishop, and L. M. Mackin, "Modeling and measurement of optical turbulence by tomographic imaging of a heated air flow," *SPIE*, Vol. 28, 2007